


ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO Nr AP 016

wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie nr 7 Data wydania: 14 września 2011 r.

 <p style="text-align: center;">AP 016</p>	<p>Nazwa i adres</p> <p style="text-align: center;">INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Szachowa 1 04-894 Warszawa</p> <p style="text-align: center;">ZAKŁAD KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ LABORATORIUM APARATURY POMIAROWEJ EMC ul. Swojczycka 38 51-501 Wrocław</p>
<p>Kategoria laboratorium: działające w stałej siedzibie (S)</p>	<p>Dziedziny akredytacji¹⁾</p> <p>Wielkości elektryczne w.cz. (8.01)</p> <p>Wielkości magnetyczne i elektromagnetyczne (9.01)</p> <hr/> <p>Kierownictwo laboratorium</p> <p>Marek Michalak - kierownik laboratorium</p> <p>Marek Kałuski - zastępca kierownika laboratorium</p>

Wersja strony: A

¹⁾ Numeracja dziedzin i poddziedzin zgodna z klasyfikacją podaną w załączniku do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
LABORATORIÓW WZORCUJĄCYCH**

RYSZARD MALESA

Nazwa wielkości fizycznej i rodzaj przyrządu pomiarowego	Zakres pomiarowy	Zdolność pomiarowa CMC	Kat. Lab.	Uwagi
8. Wielkości elektryczne w.cz.				
8.01 wielkości elektryczne w.cz.				
Mierniki zaburzeń radioelektrycznych - dokładność częstotliwości dostrojenia - dokładność wskazań napięcia w.cz. - odpowiedź na impulsy wzorcowe	10 kHz ÷ 1 GHz (0 ÷ 120) dB (1µV) 10 kHz ÷ 1 GHz	10 ⁻³ % 0,5 dB 1,0 dB	S	
Generatory impulsów wzorcowych - częstotliwość - powierzchnia impulsów - amplituda widmowa impulsów	1 Hz ÷ 10 kHz pasmo A: 13,5 µVs pasmo B: 0,316 µVs pasmo C, D: 0,044 µVs (20 ÷ 80) dB (1µV) (QP)	0,1 % 0,2 µVs 0,02 µVs 0,002 µVs 1,0 dB	S	QP - wartość quasi-szczytowa
Analizatory zaburzeń krótkotrwałych - dokładność ustawienia poziomu analizy zaburzeń - czas trwania grupy zaburzeń	(20 ÷ 100) dB (1µV) 100 µs ÷ 6 s	0,5 dB 2 %	S	
Sieci sztuczne - moduł impedancji - kąt impedancji - tłumienie filtru górnoprzepustowego - tłumienie odsprężenia - tłumienie przesłuchu	(2 ÷ 200) Ω (0 ÷ 90)° (0,1 ÷ 20) dB (10 ÷ 80) dB (10 ÷ 80) dB	3 % 5° 0,4 dB 1,5 dB 1,5 dB	S	9 kHz ÷ 30 MHz
Cęgi absorpcyjne MDS - tłumienność wtrąceniowa	(0 ± 20) dB	1,5 dB	S	
Sondy napięciowe - tłumienność wtrąceniowa	(10 ÷ 80) dB	0,5 dB	S	
Sondy prądowe - admitancja przeniesienia	(-30 do +3 0) dB (1S)	1,0 dB	S	
Mierniki mocy - dokładność wskazań mocy w funkcji częstotliwości - dokładność wskazań mocy w funkcji poziomu mocy	100 kHz ÷ 26 GHz (-30 ÷ 45) dB (1mW)	0,5 dB 1 dB	S	
Układy CDN - moduł impedancji - kąt fazowy - tłumienność wtrąceniowa	(150 ± 100) Ω (-40 ÷ 40)° (0,1 ÷ 40) dB	5 % 3° 0,5 dB	S	
Generatory ESD - napięcie probiercze impulsu - wartość szczytowa prądu rozładowania - prąd rozładowania po 30 ns - prąd rozładowania po 60 ns - czas narostu impulsu rozładowania	(0,5 ÷ 20) kV (1 ÷ 40) A (1 ÷ 40) A (1 ÷ 40) A (0,4 ÷ 5) ns	4 % 5 % 5 % 5 % 6 %	S	
Generatory EFT/B - czas trwania wiązki impulsów - okres powtarzania wiązki impulsów - czas narostu impulsu - czas trwania impulsu - wartość szczytowa impulsu - częstotliwość powtarzania impulsów w wiązce	(0,5 ÷ 20) ms (200 ÷ 400) ms (3 ÷ 10) ns (10 ÷ 100) ns (0,1 ÷ 8) kV (3 ÷ 120) kHz	4 % 4 % 5 % 5 % 5 % 2 %	S	
Generatory udarów - czas narostu impulsu dla napięcia obwodu otwartego - czas trwania impulsu do półszczytu dla napięcia obwodu otwartego - wartość szczytowa napięcia dla obwodu otwartego - czas narostu impulsu dla prądu w obwodzie zwartym - czas trwania impulsu do półszczytu dla prądu w obwodzie zwartym - wartość szczytowa prądu dla obwodu zwartego	(0,5 ÷ 15) µs (100 ÷ 1000) µs (0,2 ÷ 6) kV (0,5 ÷ 20) µs (5 ÷ 500) µs (0,1 ÷ 4) kA	6 % 5 % 4 % 4 % 5 % 4 %	S	
9. Wielkości magnetyczne i elektromagnetyczne				
9.01 Wielkości magnetyczne i elektromagnetyczne				
Anteny pomiarowe - współczynnik antenowy (współczynnik kalibracji)	(-7 ÷ 35) dB	2,0 dB	S	

Wersja strony: A

Zdolność pomiarowa CMC stanowi niepewność rozszerzoną dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$, co odpowiada poziomowi ufności ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach dotyczy procentowego udziału wartości wielkości mierzonej. W pozostałych przypadkach CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 016

Status zmian: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
LABORATORIÓW WZORCUJĄCYCH**

RYSZARD MALESA
dnia: 14.09.2011 r.